

LSI テスト技術の動向 (VTS2018 報告)

講師：畠山一実先生（群馬大学）

日時：2018 年 7 月 30 日（月） 12:40～14:10

場所：群馬大学工学部(桐生キャンパス) 総合研究棟 303 号室

概要：

AI や IoT の利用の広がりによる LSI の応用分野拡大に伴い、その品質確保のためのテスト技術の重要性が一段と高まっています。本講演では、LSI テスト技術の最新動向として、2018 年 4 月に米国で開催された VTS (VLSI Test Symposium) 2018 における技術動向について紹介します。





- 論文発表は米国が圧倒的に多い (30 件中 19 件)
- 発表で下記内容が充実
 - セキュリティ関係
 - テスト結果データ活用
 - 高信頼性化



初回の VLSI Test Symposium は 1983 年に米国東海岸 Atlantic City で開催
ギャンブルの町のため、VTS のロゴに 次の言葉が使用.

Without testing, it's a gamble.

VLSI Test Symposium 2019 は米国カリフォルニア州モントレ市で開催
投稿登録締切 2018 年 10 月 5 日 (金)、論文投稿締切 10 月 12 日 (金)
http://tttc-vts.org/public_html/new/2019/

写真 群馬大学 石川信宣 文責 小林春夫